

# Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0205U006476

Державний реєстраційний номер: 0104U010073

Відкрита

Дата реєстрації: 15-11-2005



## 1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

**Назва етапу:** Розвиток комплексу методів практичної діагностики для супроводження сучасних технологій отримання наноструктур із заданими фізичними і фізико-хімічними параметрами та характеристиками

**Початок етапу:** 10-2004

**Закінчення етапу:** 12-2005

**Вид звітного документа:** Остаточний звіт

## 2. Виконавець

**Назва організації:** Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

**Код ЄДРПОУ/ІПН:** 05416952

**Підпорядкованість:** Національна академія наук України

**Адреса:** пр. Науки 41, 03028, м. Київ-28

**Телефон:** 265 40 20

**Інше:** 265 83 42

## 3. Власник результатів НДДКР (продукції)

**Назва організації:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код ЄДРПОУ/ІПН:** 02070944

**Адреса:** 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

**Підпорядкованість:** Міністерство освіти і науки України

## 4. Джерела та напрями фінансування

**Підстава для проведення робіт:** 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

**КПКВК:**

**Напрямок фінансування:**

**Джерела фінансування**

## 5. Науково-технічна робота

**Назва роботи (укр)**

Розвиток комплексу методів практичної діагностики для супроводження сучасних технологій отримання наноструктур із заданими фізичними і фізико-хімічними параметрами та характеристиками

### **Назва роботи (англ)**

The complex of methods development for practical diagnostic and support of modern technologies for nanostructures production with specified physical and physico-chemical parameters and characteristics.

### **Реферат (укр)**

Проведено теоретичний аналіз особливостей дифракції рентгенівських променів в надграткових напівпровідникових структурах із локальними неоднорідностями типу квантових точок та удосконалена рентгенодифрактометрична методика для її використання в неруйнівній діагностиці компонентного складу напівпровідникових наноструктур.

### **Реферат (англ)**

Theoretical analysis of the X-ray diffraction peculiarities in semiconductor superlattice structures containing quantum dots has been carried out. X-ray technique for nondestructive composition analysis of semiconductor nanostructures was improved.

**Індекс УДК:** 539.2;538.9-405;548, 535-34

**Коди тематичних рубрик НТІ:** 29.19

## **6. Науково-технічна продукція (НТП)**

## **7. Бібліографічний опис**

5490

## **8. Звітна документація**

**Кількість сторінок в звіті:** 29

**Мова звіту:** Українська

**Умови поширення в Україні:** Не заборонено

**Умови передачі іншим країнам:** Не заборонено

**Кількість файлів у звіті:** 0

## **9. Заключні відомості**

### **Перелік організацій-виконавців**

**Назва організації:** Національний технічний університет "ХПІ"

**Код ЄДРПОУ/ІПН:** 02071180

**Адреса:** Україна, 61002, м. Харків вул. Фрунзе, 21

**Підпорядкованість:**

**Керівник організації:**

Мачулін Володимир Федорович

**Керівники роботи:**

Прокопенко Ігор Васильович

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності  
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.